

用化学法增透激光晶体

中国人民解放军后字 419 部队 304 组

本文以钇铝石榴石(YAG)晶体为例,叙述了化学溶液离心水解成膜法的原理、膜厚控制以及增透激光材料的实验结果。用这种方法镀制的减反射膜,牢固而稳定,反射率较低;所用设备和工艺操作都比较简单,因而成本低廉,易于实现。

引 言

在一般的固体激光器中,要求尽量减小激光棒的端面反射损失。特别是在高功率行波激光放大器中,激光棒端面的微小反射,会形成反馈振荡,使工作效率极度降低。此外,用作电光调 Q 的晶体,也要求消除其工作面的反射损失。

给激光棒端面镀以减反射膜,原则上可以完全消除端面反射。对这类减反射膜的要求是:机械强度高,化学稳定性好,能承受一定的激光功率;也就是要求镀制出经得起清洗、能抗大气腐蚀的使用寿命长的减反射膜。

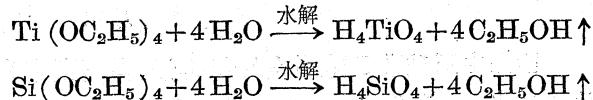
镀制光学薄膜通常使用三种方法,即阴极溅射法、真空蒸发法和化学法。从膜的机械强度和化学稳定性来讲,用阴极溅射法一般可以得到最好的结果,而且,这种方法原则上可以“溅射”各种金属和介质。但是,阴极溅射法的设备比较复杂,对“射频溅射”介质尤其如此;而用“三极反应溅射”系统,“溅射”速率又很低^[1],致使“溅积”薄膜的周期很长。真空蒸发法是目前使用最为广泛的镀膜方法,其突出优点是生产效率高,产品重复性好,并通过光电方法实现膜层厚度的精确控制。不过,真空蒸镀的薄膜,一般说机械强度和化学稳定性较差;而且适于真空阻热式蒸发的实用膜料非常有限。例如,常用的低折射率膜料为氟化镁(MgF_2)和冰晶石(Na_3AlF_6),高折射率膜料为硫化锌(ZnS)。由这些材料制成的膜很软,经不起擦洗。虽然将镀件用辉光放电彻底“气洗”并加热至 250°C 左右,可以得到格外牢固的单层氟化镁膜,但这个方案只能用来完全增透一种晶体,即要求其折射率恰好等于 MgF_2 的折射率底平方;况且由于单层减反射膜的有效增透区(反射率接近零)较窄,这就要求膜厚控制必须非常精确,才会得到对于预定波长的接近完全的消反射;再有,某些被镀晶体的物理性质也不容许加热到 250°C。由于这些原因,使真空蒸镀单层氟化镁膜的增透方法受到限制。当然,改用电子束蒸发可以大大扩展实用膜料的范围。例如,用电子束真空蒸发二氧化钛(TiO_2)和二氧化硅(SiO_2)^[2],可以形成坚硬、稳定的薄膜。

在光学薄膜的工业生产中,与真空蒸发法并行地使用着化学溶液离心水解成膜法,用以增透玻璃零件。我们把这种方法移用来增透激光晶体,得到了牢固、稳定的减反射膜,其反射率较低。这种方法的设备、工艺操作都比较简单,易于实现和普遍采用。

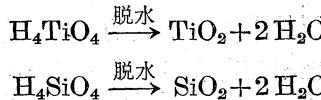
成膜原理和膜厚控制

化学溶液离心水解成膜法，是将预先配制好的浓度一定的成膜溶液，滴镀在按预定转速旋转的镀件表面，溶液水解而展成薄膜。目前使用最为广泛的成膜材料，是正钛酸乙酯 $[Ti(OC_2H_5)_4]$ 和正硅酸乙酯 $[Si(OC_2H_5)_4]$ 的酒精溶液(还可用其他材料，如 $ThNO_3$, $HfOCl_2$ ^[3])。这些溶液的成膜过程可分为两步：

1. 溶液滴镀在旋转镀件表面的瞬时，离心水解，形成正钛酸和正硅酸薄膜(湿膜)



2. 镀有湿膜的镀件在空气中加热至 $120^{\circ}C$ 左右，湿膜脱水，最后形成透明牢固的二氧化钛(TiO_2)膜和二氧化硅(SiO_2)膜



化学溶液离心水解成膜法的一个首要问题，是如何控制膜层厚度，以便得到预定的光学特性。可以直观地想到，离心水解成膜的厚度依赖于滴镀条件以及继后的脱水温度。就滴镀条件来说，显然，成膜厚度与溶液浓度、镀件转速和镀件尺寸有着内在的关系。资料[4]的作者用孤立因素法，从大量实验数据中推得每个因素与膜厚的定量关系，最后得到如下的关于成膜厚度的经验公式：

$$(nd)_{TiO_2} = 13800 w^{-0.455} D^{-0.155} C \quad (1)$$

$$(nd)_{SiO_2} = 95500 w^{-0.714} D^{-0.243} C \quad (2)$$

式中 $(nd)_{TiO_2}$ ——在 $120\sim140^{\circ}C$ 下烘烤脱水形成的 TiO_2 膜的光学厚度，单位为埃(Å)

$(nd)_{SiO_2}$ ——在 $120\sim140^{\circ}C$ 下烘烤脱水形成的 SiO_2 膜的光学厚度，单位为埃(Å)

w ——镀件转速(转/分)

D ——镀件直径(毫米)

C ——成膜溶液的百分浓度(据实验校核，应指体积百分浓度)

镀件直径范围为 $5\sim250$ 毫米；被镀表面可以是平面，也可以是球面，只要表面与其曲率半径构成的立体角小于4.5。值得注意的是，上述公式与镀件玻璃牌号无关，与被镀表面有否膜层无关，推广说来，就是与镀件材料无关，只要是光学抛光的表面都适用。成膜溶液是：正硅酸乙酯酒精溶液，加入 $0.1\sim0.25\%$ 的盐酸，每一克分子乙酯含 $2\sim4$ 克分子水；正钛酸乙酯酒精溶液，加入 $0.075\sim0.25\%$ 的盐酸，酒精浓度为 $98.5\sim99.5\%$ 。

据原文的实验验证，我们的实验检验以及用化学镀膜生产的工艺规范校核，上述公式的精确度为 $\pm 5\%$ ，是可资利用的。

钇铝石榴石(YAG)的增透实验及其结果

激光晶体钇铝石榴石(YAG)，在波长 $\lambda_0=10648\text{\AA}$ 处的折射率 $n_s=1.8182^{[5]}$ ，因此，YAG

棒在空气中每个端面的反射率为 8.5%。若在端面镀以两层减反射膜，每层厚度为 $\lambda_0/4$ ，即 $n_1d_1=n_2d_2=\lambda_0/4$ ，如图 1 所示，则端面反射率变为^[6]

$$R = \left(\frac{n_1^2 n_s - n_2^2 n_0}{n_1^2 n_s + n_2^2 n_0} \right)^2 \quad (3)$$

式中 n_0 、 n_1 、 n_2 和 n_s 分别为空气、顶层膜、底层膜和基底材料的折射率，并且 $n_0=1$ 。完全消除反射的条件为

$$n_0=1$$

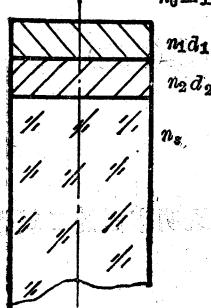


图 1

即

$$n_1^2 n_s - n_2^2 = 0$$

$$n_2 = n_1 \sqrt{n_s} \quad (4)$$

已知由正硅酸乙酯形成的 SiO_2 膜，其折射率为 1.45。若令 $n_1=1.45$ ，并同时将 $n_s=1.82$ 代入公式(4)，则可算出为了完全消除反射，底层膜应有的折射率值

$$n_2=1.96 \quad (5)$$

又知由正钛酸乙酯形成的 TiO_2 膜，其折射率为 2.0~2.1，接近式(5)的数值，但不完全满足。假如以 $n_1=1.45$ ， $n_2=2.1$ ， $n_s=1.82$ 代入式(3)，那末可能得到的最小反射率为

$$R_{\min}=0.5\%$$

为要得到尽可能低的反射率，就应使底层膜的折射率尽可能接近或等于式(5)的数值。为此，用 TiO_2 膜作底层，但在正钛酸乙酯酒精溶液中按 4:1 的体积比混以浓度相同或相近的正硅酸乙酯酒精溶液，使其成膜后的折射率低于 2.0，并可非常接近数值 1.96*，从而得到接近完全的增透。

这样，我们就确定两层减反射膜的结构。

顶层： SiO_2 膜，其光学厚度为

$$n_1 d_1 = (nd)_{\text{SiO}_2} = \lambda_0/4 = \frac{1}{4} \times 10648 \text{ \AA}$$

底层： TiO_2 膜（混有少量 SiO_2 ），其光学厚度为

$$n_2 d_2 = (nd)_{\text{TiO}_2} = \lambda_0/4 = \frac{1}{4} \times 10648 \text{ \AA}$$

下面，我们就利用公式(1)和(2)来确定获得膜层规定厚度的各个参数。

首先，实验用的 YAG 晶体棒的端面直径常为 5~6 毫米，为使薄膜的“边框”尽量窄，应采用很高的转速，故我们取 $w=10^4$ 转/分。假定镀膜晶体的端面直径 $D=5.5$ 毫米，那末将上述数据代入公式(1)和(2)，便求得正钛酸乙酯和正硅酸乙酯酒精溶液的浓度分别为 16.4% 和 30.1%。这就是说，为要得到光学厚度为 $\frac{1}{4} \times 10648$ 埃的 TiO_2 膜，滴镀条件应当是

晶体棒直径

$D=5.5$ 毫米

晶体棒转速

$w=10^4$ 转/分

正钛酸乙酯酒精溶液浓度

$C_{\text{Ti}}=16.4\%$

* 这种按比例混合以调节膜层折射率的方法，在光学工业中已成定型操作。

而获得光学厚度为 $\frac{1}{4} \times 10648$ 埃的 SiO_2 膜，滴镀条件应当是

晶体棒直径

$D=5.5$ 毫米

晶体棒转速

$w=10^4$ 转/分

正硅酸乙酯酒精溶液浓度

$C_{\text{Si}}=30.1\%$

并且湿膜脱水温度均为 $120\sim140^\circ\text{C}$ 。

根据上面的讨论和计算，涂镀一根直径 $D=5.5$ 毫米的 YAG 晶体棒，其具体工艺过程如下：

1. 预先配制好浓度为 30.1% 的正硅酸乙酯酒精溶液，酒精浓度为 94~96%，即含水量为 4~6%；镀膜前临时配制浓度为 16.4% 的正钛酸乙酯酒精溶液，酒精浓度为 98~98.5%，视镀膜室的温度和湿度而定。

2. 将晶体棒竖直夹持于离心机上，用细软擦巾蘸酒精—乙醚混合液细心擦洗被镀端面，然后以 $w=10^4$ 转/分的转速使晶体旋转起来。

3. 镀第一层(底层)。按体积比 4:1，在 4 份浓度为 16.4% 的正钛酸乙酯酒精溶液中，混以 1 份浓度为 16% 的正硅酸乙酯酒精溶液，用玻璃管搅匀后，滴镀在旋转着的晶体端面；湿膜呈光亮的浅兰色。

4. 镀第二层(顶层)。接着，在第一层湿膜上滴镀浓度为 30.1% 的正硅酸乙酯酒精溶液，湿膜呈深金黄，略反橙红色。

5. 将镀好膜的晶体在空气中于 $120\sim140^\circ\text{C}$ 的温度下，烘烤 2~3 小时以上，使湿膜脱水。干膜呈浅金黄色。

为了检验所镀膜系的减反射效果，而薄膜又镀在直径仅 5~6 毫米的晶体棒端面，要直接测量 1% 以下的反射率相当困难，所以我们做了以下检验实验。

1. 自激振荡实验。如图 2 所示，在普通的实验激光器的聚光腔中，安置细而长的晶体 ($D=4$ 毫米, $L=47$ 毫米)，用纸片 MM' 挡住全反射镜 R_1 。在晶体不镀减反射膜的情况下，由于晶体端面具有 8.5% 的反射率，故当闪光灯泵浦能量接近 40 焦耳时，便形成自激振荡，接收器即有明显的输出指示。按照上述工艺过程，用化学法在晶体端面镀以两层减反射膜之后，则当闪光灯泵浦能量高达 150 焦耳时，接收器仍无输出指示，表明尚未形成可观察到的自激振荡。这说明减反射膜的效果是很明显的。

2. 镀膜前后晶体激光输出比较实验。实验装置如图 2 所示，此时去掉挡片 MM' 。在其他条件相同时，镀膜前后晶体的输出能量同泵浦能量之间的关系如图 3 所示。可见，晶体镀膜后输出能量大有提高。

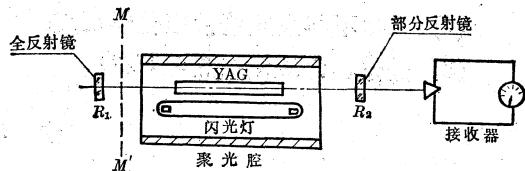


图 2 激光检验镀膜晶体(YAG)示意图

$R_1 > 99\%$, $R_2 = 30\%$, MM' —纸片

结 论

1. 化学溶液离心水解成膜法，可用来增透激光晶体；用正钛酸乙酯和正硅酸乙酯酒精溶

液作为成膜材料, 可使 YAG 晶体的表面反射率显著降低。

2. 化学法形成的 TiO_2 膜和 SiO_2 膜, 分别在 0.35~12 微米和 0.2~8 微米波段是透明无吸收的, 膜牢固而稳定, 经得起水泡, 在使用中可用酒精、丙酮多次清洗。目前我们在 YAG 晶体棒端面镀制的两层减反射膜, 长期使用在峰值约 10 兆瓦、脉冲宽度约 70 毫微秒、每秒重复 5 次的激光功率下而未破坏。若需进一步提高膜的牢固性, 可在镀膜之前用苛性碱水溶液“激活”(即擦洗)被镀表面, 并使湿膜脱水温度升高到 400~500°C [当然, 此时成膜厚度公式(1)和(2)须作相应修正]。

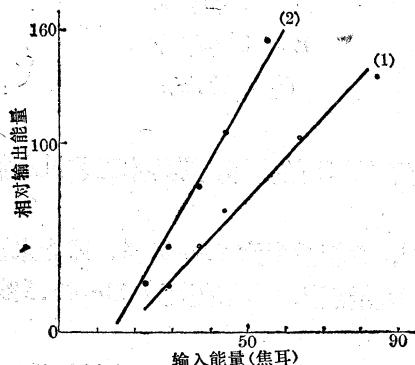


图 3 晶体激光输出与抽运能量之关系

晶体尺寸: $D=5.5$ 毫米, $L=28$ 毫米

(1) 未镀晶体; (2) 镀膜晶体

4. 在推出 YAG 晶体棒端面两层减反射膜的零反射条件时, 利用了公式(3), 这里是把 YAG 当作纯粹无吸收的透明媒质处理, 其折射率为实数 n_s 。事实上, 在光泵的作用下, YAG 是具有放大能力, 即具有负吸收系数的媒质, 其折射率为复数 $N_s = n_s + i \left(\frac{\alpha\lambda}{4\pi} \right)$, 式中 α 是增益系数或负吸收系数。因之, 零反射条件应作相应的修正^[3]。不过, 当激光晶体的增益系数 α 不太大时(例如不大于 10^6 /米), 这种修正可以略去。YAG 晶体就正属于这种情形。

5. 用化学法可以保护或增透各种激光应用晶体。例如, 用单层 $\lambda/4$ 厚的 SiO_2 膜增透作电光调 Q 的铌酸锂($LiNbO_3$)晶体, 得到了满意的结果。若以正钛酸乙酯和正硅乙酯酒精溶液作为成膜材料, 原则上, 可以增透或保护满足下述条件的各种晶体:

- (1) 晶体折射率在 $1.45 < n_s \leq 4$ 的范围;
- (2) 晶体不与成膜溶液起化学反应;
- (3) 晶体容许缓慢加热至 $80^\circ C$ 。

参 考 资 料

- [1] R. L. Ganey, H. J. Seguin; *Rev. Scient. Instrum.*, 1970, **43**, No. 3, 427. *Vacuum* 19, NOII, 485~511. *Sputtering Meeting* J. J. Besson Suppl to le vide, 23, (136), 57~61.
- [2] J. T. Cox, H. Hass, J. B. Ramsey; *J. de phys.*, 1964, **25**, 250 (France).
- [3] A. K. Девдариани, А. И. Свиридова, Л. Ю. Куртц; *ОМП*, 1970, № 3, 41.
- [4] Т. А. Александров; *ОМП*, 1958, № 1, 25.
- [5] R. F. Belt; *Laser Focus*, 1970, **6**, No. 4, 44.
- [6] Antonin Vasicek; *Optics of Thin Films*.
- [7] H. A. Macleod; *Thin Film Optical Filters*.
- [8] Vern N. Smiley; *JOSA*, 1968, **58**, No. 11, 1469.